11A, 16A/2011PF-02, 2011G597, 2009S2-008 共鳴軟 X 線小角散乱による(Fe,Co)Si の磁気散乱観測 Small Angle Resonant Soft X-ray Magnetic Scattering in (Fe,Co)Si

山崎裕一、中尾裕則、須田山貴亮、岡本淳、村上洋一、久保田正人^A、 于秀珍^B、柴田基洋^C、金澤直也^C、小野瀬佳文^C、十倉好紀^{B, C, D, E} KEK 物構研 PF/CMRC, JAEA^A, RIKEN-CERG^B, 東大工^C, RIKEN-CMRG^D, ERATO-MF^E

1 <u>はじめに</u>

B20型結晶構造を有する(Fe,Co)Si は、ゼロ磁場に おいてヘリカル磁性体であるが、磁場中のA相と呼 ばれる温度・磁場領域ではスピンが渦上に配列した スキルミオン格子(図 a)を形成することが、中性 子小角散乱[1]やローレンツ電子顕微鏡[2]によって 観測されている。本研究では、(Fe,Co)Si において 磁気散乱の観測を目的に研究を行った。軟 X線散乱 法は、元素選択性や、スペクトル解析による電子状 態の解析、MCD の総和則によるスピンと軌道モー メントの観測、円偏光軟 X線を利用したスピンヘリ シティの検出などの利点が挙げられる。

2 実験

本研究では磁気変調波長が 90 nm に達する Fe_{0.5}Co_{0.5}Si を、イオンミリング法によって軟 X 線が 透過する sub- μ m 程度まで薄く加工して実験を行っ た。小角領域の共鳴軟 X 線散乱を測定する装置を開 発し、Fe と Co の L 吸収端において共鳴軟 X 線散乱 実験を行った。装置にはヘルムホルツコイルを取り 付け X 線入射方向に磁場を印加できるようにし、回 折光は CCD カメラを用いて観測した。

3 結果および考察

図 b には CCD カメラで観測した Fe の L3 吸収端 における共鳴軟 X 線磁気散乱を示している。2 つの 回折光は Fe0.5Co0.5Si のゼロ磁場で観測されているへ リカル磁気構造からの反射に対応している。同じよ うに Coの L 吸収端においても磁気散乱を観測して おり、元素ごとに磁気散乱を観測できたことになる。 図 cには FeのL端における共鳴軟X線磁気散乱の エネルギー依存性を示している。L3吸収端ではピー クが観測されているのに対して、L2 吸収端では磁 気散乱がほとんど観測されていない。磁場をかけた 状態で測定した XMCD スペクトに関しても同じよ うに L2 吸収端ではほとんど観測されなかった。磁 気散乱強度は XMCD スペクトルに 2 乗に比例する ことからコンシステントな結果といえる。XMCD の 総和則から、これらの結果は軌道モーメントが凍結 していないことを示唆している。

このヘリカル磁気構造に磁場を印加したところ、 磁場方向に変調ベクトルが揃い、さらに磁場を印加 すると、磁場と垂直方向に変調ベクトルが向くよう な変調ベクトルのフロップが観測された。このフロ ップ相はバルク試料に比べ低温まで拡がっているこ とを確認した。これは、サンプルを薄くした効果に よるものと考えられる。



(a) スカーミオン格子。(b) Fe L₂吸
収端における軟 X 線磁気散乱と(c)
そのエネルギー依存性

参考文献

[1] W. Münzer et al., Phys. Rev. B 81, 041203(R)(2010)

- [2] X. Z. Yu et al., Nature 465, 901 (2010)
- * yuichi.yamasaki@kek.jp